

S2VB

600V 2A

特長

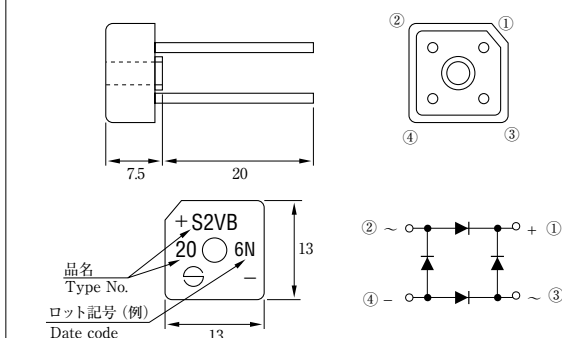
- 耐湿性に優れ高信頼性
- 高耐熱性
- 低 I_R

Feature

- High-Reliability
- Heat Resistance
- Low I_R

■外観図 OUTLINE

Package : S2VB

Unit : mm
Weight : 3g (typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

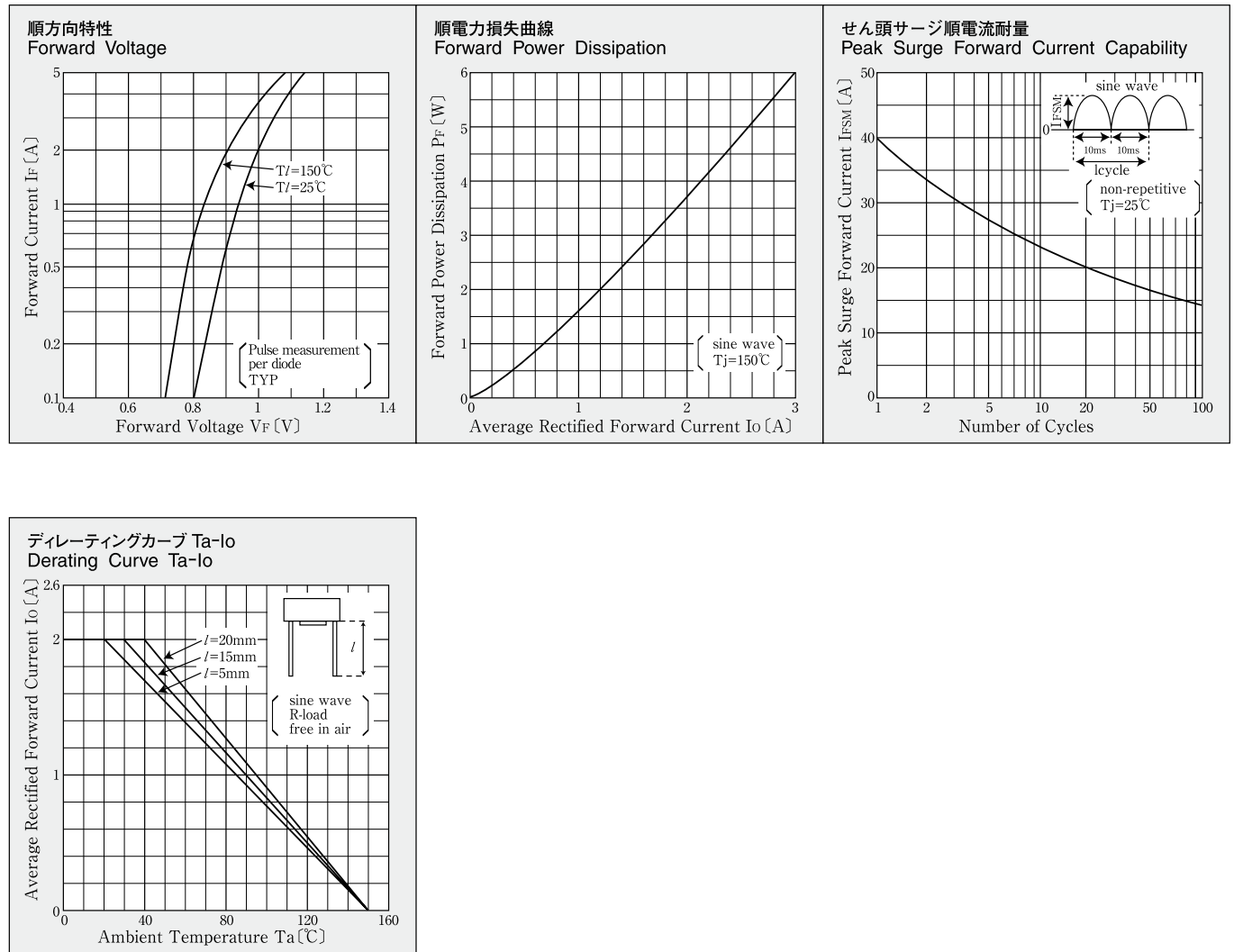
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S2VB20	S2VB60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			- 40 ~ 150		$^\circ\text{C}$
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150		$^\circ\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			200	600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, フィンなし, $T_a = 40^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, Without heatsink, $T_a = 40^\circ\text{C}$		2		A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value $T_j = 25^\circ\text{C}$		40		A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I^2t	$1\text{ms} \leq t < 10\text{ms}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$, 1 素子当たりの規格値 per diode		6		A^2s
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値 : $0.3 \text{ N} \cdot \text{m}$) (Recommended torque : $0.3 \text{ N} \cdot \text{m}$)		0.5		$\text{N} \cdot \text{m}$

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 1\text{A}$, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RM}$, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	$\theta_{j\ell}$	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 7	$^\circ\text{C}/\text{W}$

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.